

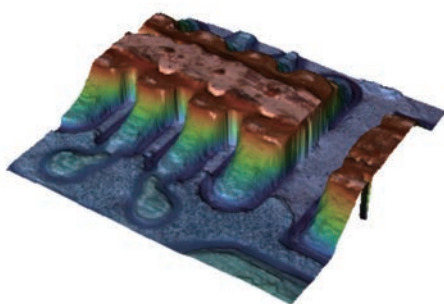
表面解析を新次元へ。

信頼の測定技術で、あらゆる表面を解析

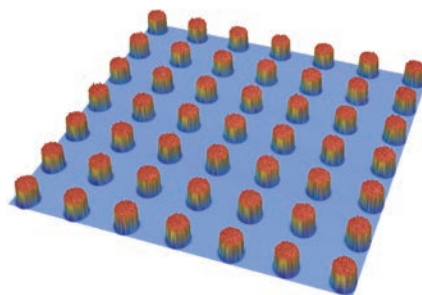
白色干渉計搭載 3D 測定レーザー顕微鏡

LEXT OLS5500

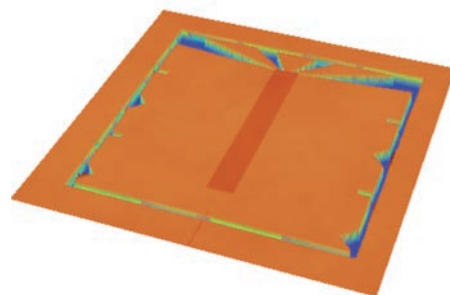
◀ 3-in-1 Hybrid system ▶



フォーカスバリエーション



レーザー顕微鏡



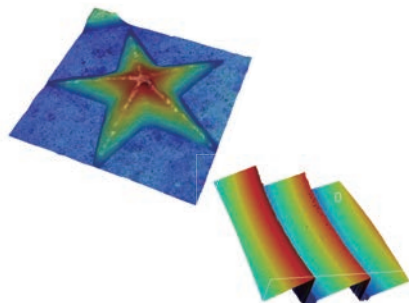
白色干渉計

レーザー顕微鏡(LSM)、白色干渉計(WLI)、フォーカスバリエーション(FVM)の高精度な測定性能、スマートな自動化機能、直感的な操作性により、あらゆる用途で自信を持ってご使用いただけます。

Key Values

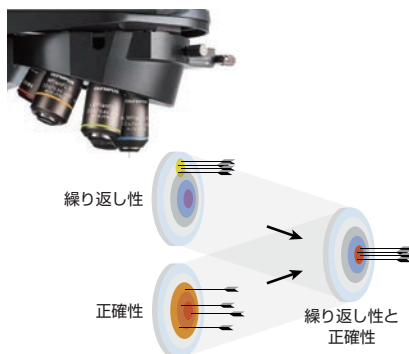
1 比類なき イメージングソリューション

- nm から mm まで 1 台で対応できる
シームレスな 3-in-1 ソリューション
- 自社開発・設計の光学系による
高い光学性能
- 微細な構造から透明なものまで
見えないものを可視化



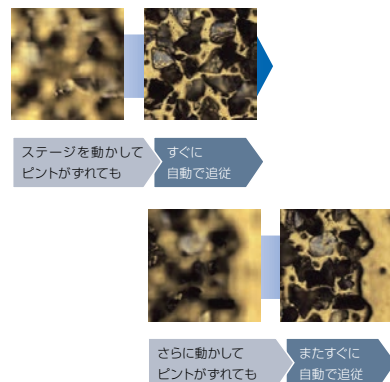
2 揺るぎない測定品質

- 測定環境下における
測定精度保証※
※ レーザー顕微鏡は ISO/IEC17025 認定校正が可能
- 世界初※ LSM と WLI ダブルでの
高さ測定ノイズ保証
※ 2025 年 10 月、当社調べによる



3 誰でもすぐにスマートに測定

- シームレスな操作フローにより
誰でも直感的に操作可能
- マクロや解析テンプレートによる
測定の自動化



■ OLS5500 製品仕様

標準仕様

型 式			OLS5500-SAF	OLS5500-EAF	OLS5500-LAF
総合倍率			54 × ― 17,280 ×		
視野サイズ			16μm ― 5120μm		
測定原理		検鏡方式	反射型共焦点レーザー顕微鏡画像、反射型共焦点レーザー微分干渉顕微鏡画像 フォーカスバリエーション検鏡法、カラー画像、カラー微分干渉画像 (ポラライザ、アナライザユニットは本体に内蔵)		
			白色干渉法		―
		光検出器	レーザー：光電子増倍管 (2系統)、カラー：CMOSカメラ		
レーザー顕微鏡	高さ測定	繰り返し性 $\sigma n-1^{*1} \cdot 2^{*5}$	5 × : 0.45μm, 10 × : 0.1μm, 20 × : 0.03μm, 50 × : 0.012μm, 100 × : 0.012μm		
		正確さ $^{*1} \cdot 3^{*5}$	0.15 + L/100μm (L：測定長 [μm])		
		高さ測定ノイズ $^{*1} \cdot 4^{*5}$	1nm [Typ]		
	幅測定	繰り返し性 $3\sigma n-1^{*1} \cdot 2^{*5}$	5 × : 0.4μm, 10 × : 0.2μm, 20 × : 0.05μm, 50 × : 0.04μm, 100 × : 0.02μm		
		正確さ $^{*1} \cdot 3^{*5}$	測定値 ± 1.5%		
最大取得データ解像度			4096 × 4096ピクセル		
最大貼り合わせ画素数			400百万ピクセル		
XYステージ		駆動範囲	100 × 100mm(電動)		300 × 300mm(電動)
		耐荷重	3kg		5kg
サンプル最大高さ			100mm	210mm	37mm
レーザー光源		波長	405nm		
		最大出力	0.95 mW		
		レーザークラス	Class 2 (JIS C 6802 : 2018, IEC60825-1 : 2014, EN60825-1 : 2014/A11 : 2021, GB/T 7247.1-2024)		
カラー光源			白色LED		
消費電力			240 W		278 W
質量		顕微鏡本体	約31kg	約43kg	約50kg
		コントロールボックス	約 12 kg		

白色干渉計仕様

白色干渉計	高さ測定	繰り返し性 $\sigma n-1^{*1} \cdot 5$	0.3%
		正確さ *6	1% [Typ]
		Surface topography repeatability $^{*5} \cdot 7$	0.08nm
		Repeatability of RMS *8	<0.008nm
	サンプル最大高さ		68mm
	耐荷重(傾斜ステージ搭載時)		1.8kg

*1:ISO554(1976)、JIS Z-8703(1983)に規定されている恒温・定湿度環境(温度:20℃±1℃、湿度:50%±10%)で使用する場合に保証される。 *2:20x 以上の場合、MPLAPON LEXT シリーズレンズで測定した場合。 *3: LEXT 専用レンズで測定した場合。 *4: MPLAPON100XLEXT の対物レンズで測定した場合の標準値で、保証値とは異なる。 *5: 当社の保証方法による。
*6: 当社が規定した条件下で国家規格にトレーサブルな標準段差サンプル(83nm)を使用して測定した代表値であり、保証値とは異なる。保証値は0.15 + L/100μmです。
*7: 高さ測定ノイズと同義 *8: 当社指定条件下での測定による。

その他同時開催キャンペーンのお知らせ

3D 測定レーザー顕微鏡 OLS5100

期間限定 特別価格

キャンペーン



OLS5100-SMT 組合せ ■標準フレーム ■手動ステージ

20%OFF

メーカー希望小売価格 ¥12,458,200(税別) ▶ ¥9,900,000(税別)

OLS5100-SAT 組合せ ■標準フレーム ■電動ステージ

15%OFF

メーカー希望小売価格 ¥17,417,200(税別) ▶ ¥14,800,000(税別)

2025年12月末日まで開催中 詳しくはお問い合わせください！

その他同時開催キャンペーンのお知らせ

デジタルマイクロスコープ

乗り換え

キャンペーン



他社製*および弊社製旧デジタルマイクロスコープより

DSX2000へご更新頂いたお客さま

※弊社指定の製品が対象となります。詳しくはお問い合わせください。

最大 ¥557,000OFF

2026年3/31 まで開催中 詳しくはお問い合わせください！